BL40XU 高フラックス

1.はじめに

本ビームラインは1999年夏に建設され、同年10月より 2000年3月末までコミッショニングを行い、2000年4月より 共同利用が開始され現在に至っている。共同利用では時分 割小角散乱実験、時分割回折実験、蛍光X線分析などが行 われ、注目すべき成果が生まれつつある。

2000年1月から2001年3月までの期間内に本ビームライン では、おもに高調波の低減を目的として水冷ミラーのコー ティングの改造を行った。本稿ではその詳細について報告 する。

2.水冷ミラーの改造

すでに報告してあるように^[1,2] BL40XUはヘリカルア ンジュレータを光源とし、分光器を用いないことにより、 高輝度X線の利用を可能にしたビームラインである。すな わち、ヘリカルアンジュレータの放射軸上に集中して放射 される一次光をフロントエンドスリットによって切り出 し、分光することなく実験ハッチに導くことで、二結晶分 光器を用いて単色化された光の100倍以上の輝度を持つX 線の利用を実現している。実験に使用できるX線のエネル ギーは、アンジュレータのギャップを変えることにより変 化する一次光のエネルギーによってきまり、そのエネルギ -領域は8keV~16.5keVである。本ビームラインの光学系 は非常にシンプルで、水平集光用(長さ400mm、幅70mm、 厚さ50mm)および垂直集光用(長さ400mm、幅50mm、 厚さ50mm)の2枚の水冷ミラーと2組の水冷スリットから 構成されている。フロントエンドスリットによって一次光 のみに切り出されたX線は、2枚のミラーによって集光さ れる。ミラーは光源とフォーカス点を4:1に分ける位置に 設置されているので、全体として4:1の縮小光学系となっ ている。集光はそれぞれのミラーをSPring-8標準のクラン プ回転型湾曲機構により湾曲させることによって行われ る。ミラーの湾曲を最適化した場合、サンプル位置でのビ -ムサイズは垂直40µm×水平250µm(FWHM)である。 アンジュレータからの光を直接受けるので、母材には熱特 性の優れたシリコン単結晶を使用し、どちらのミラーにも 間接冷却機構が取り付けてある。ミラー上でのビームのフ ットプリントを大きくし、熱不可を少なくするため上流側 に水平ミラーを3mradの視射角で配置した。また高調波の 除去を目的として、下流側に垂直ミラーを4mradの視射角 で配置した。建設された当初2枚のミラーはどちらもシリ コン単結晶の母材上にロジウムがコーティングされたもの

であった。これは4mradの視射角を持つロジウムコーティ ングのミラーでは、16keV以上のX線の反射率が非常に低 くなる、すなわちサンプル位置では高調波が非常に低い割 合でしか観測されないという計算に基づいたものであっ た。しかし、コミッショニングや共同利用実験を通してさ まざまな条件での測定が行われるうちに、特に8keV~ 10keV程度のエネルギー領域における各種測定では、高調 波(おもに二次光)の回折や高調波によるバックグラウン ドの増加といった現象が確認され、かなり深刻な障害とな っていた。この時点ではサンプル位置での二次光を低減さ せる効果的な方法はなく、12keV以上のエネルギー領域で 測定を行うか、どうしても10keV以下のエネルギー領域で 実験を行う場合は、X線が輸送チャンネルを抜けてくる条 件内で40cmミラーの視射角を深くして、二次光の低減を 図る程度であった。そこで、2000年夏期長期シャットダウ ン中にミラーのコーティングの改良を行った。反射率の計 算より、コート材にはニッケルとロジウムが選ばれた。ま た母材であるシリコン表面もミラーとして利用するためコ ーティングは図1に模式的に示すような設計とした。それ



図1 ミラーコーティングの模式図

ぞれのコーティングの幅は10mmで、ミラーを垂直方向、 水平方向にそれぞれ並進させることによりコーティングの 切り替えを行う。コーティングの改良は70cmおよび40cm のどちらのミラーに対しても行われた。

改良されたミラーを使って、2000年9月より調整および 試験運転を行った結果、8keVから10keVのエネルギー領 域では70cmがシリコン、40cmがロジウムの組み合わせが、 10keV以上のエネルギー領域では70cmがニッケル、40cm がロジウムの組み合わせがフラックスを落とすことなく、 最も効果的に二次光を除去できることが確認された。図2 に各エネルギーにおけるエネルギースペクトルを示す。こ れらのスペクトルは、フロントエンドスリット垂直



図2 各エネルギーにおけるエネルギースペクトル

0.165mm(見こみ角5µrad)×水平0.5mm(見こみ角 15µrad)の条件で、サンプル位置に置いたSi(111)のア ナライザ結晶を用いて測定された。どのエネルギーにおい ても、スペクトルには一次光のピークしか観測されず理想 的に二次光が除去されていることがわかった。またミラー の湾曲を最適化したときのビームサイズは、どのエネルギ ーにおいてもコーティングを改良する前と全く変わらなか った。さらに、二次光が除去されていることから、各エネ ルギーにおけるフラックスをより正確に測定することがで き下記のように見積もられた。

 6.5×10^{14} photons/sec (@8 keV) 9.0 × 10¹⁴ photons/sec (@10 keV) 3.0 × 10¹⁵ photons/sec (@11.5 keV) 1.0 × 10¹⁵ photons/sec (@12.4 keV) 6.0 × 10¹⁴ photons/sec (@15 keV)

2000年10月以降の共同利用実験では改良されたミラー が、各ユーザーによりそれぞれの実験に最適な組み合わせ で使用されており、より精度の高いデータ収集が行われて いる。

(井上 勝晶)

文献

- [1] K.Inoue, et al.: Nucl. Instr. and Meth. A 467-468 (2001) 674.
- [2] 井上勝晶 他: SPring-8 利用者情報誌 Vol.5, No.3 (2000) 189-193.